

# □ 解析・分析

各種 観察・解析・分析サービスを提供しております

電子顕微鏡観察・分析		質量分析法	
(走査)透過電子顕微鏡法	(S)TEM	二次イオン質量分析法	SIMS
TEM電子回折マッピング法	TEM ED-Map	飛行時間型二次イオン質量分析法	TOF-SIMS
エネルギー分散型X線分光法(TEM)	TEM-EDX	ガスクロマトグラフィー質量分析法	GC/MS
電子エネルギー損失分光法	TEM-EELS	液体クロマトグラフィー質量分析法	LC/MS
電子回折法	ED	高速液体クロマトグラフ法	HPLC
三次元SEM観察法	Slice&View	イオンクロマトグラフ法	IC
電子後方散乱回折法	EBSD	誘導結合プラズマ質量分析法	ICP-MS
電子線誘起電流	EBIC		
走査イオン顕微鏡法	SIM		

電子分光法		X線回折関連・振動分光	
オージェ電子分光法	AES	X線回折法	XRD
X線光電子分光法	XPS	X線反射率法	XRR
紫外光電子分光法	UPS	X線小角散乱法	SAXS
X線吸収微細構造	XAES	フーリエ変換赤外分光法	FT-IR
軟X線発光分光法	SXES	ラマン分光法	Raman

